

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△	2	RE-F-09653	中村	山口	04.04.06	△					
△	1	RE-F-10251	土井	小沢	05.02.02	△					
適 用 規 格											
定 格	使用温度範囲		-55℃ ～ 85℃			保存温度範囲		-10℃ ～ 60℃ (注3)			
	電 圧		AC 100 V			使用湿度範囲		40 % ～ 80 %			
	電 流		0.4 A			保存湿度範囲		40 % ～ 70 % (注3)			
性 能											
	項 目		試 験 方 法			規 格			QT	AT	
構 造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示		目視にて確認する。						○	○	
電 気 的 性 能	接触抵抗		100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			80 mΩ以下 (注1)			○	—	
	低電圧、低電流下の接触抵抗		20 mV以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。			100 mΩ以下 (注2)			○	—	
	絶縁抵抗		DC 250 Vで測定する。			100 MΩ以上			○	—	
	耐電圧		AC 300 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—	
機 械 的 性 能	繰り返し動作		50 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	耐振性		周波数 10 ～ 55 Hz, 振幅 1.5 mm, 3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2)			○	—	
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2) ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上			○	—	
	温度サイクル		温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ 2～3 → 30→ 2～3 分を 5 サイクル試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	塩水噴霧		濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2)			○	—	
	硫化水素		濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—	
	はんだ耐熱性		リフローの場合: ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内 はんだごての場合: こて温度 360℃ △ はんだ付け時間 5 秒以内			外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。			○	—	
	はんだ付け性		△ はんだ温度 240±3℃, 浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95 %以上が新しいはんだでぬれていること。			○	—	
備考											
注1. 本製品のスタッキング高さ16mmタイプでの導体抵抗を考慮し、接触抵抗の初期値を80mΩとする。						製 図		担 当		検 図	
注2. 試験後、初期値からの変化量が20mΩ以下のこと。						HIF 03.01.17 鈴木		HIF 03.01.24 中村		HIF 03.01.24 大川	
注3. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。						IC 03.01.24 吉村				出 図	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 FX8C-※※P-SV4 (93)		
IBCL CL			図番 SLC4-151089-23			製品コード CL578			1 1		

